

FastIL: 革新的连接性测试

VIAVI 的无源器件测试仪 (PCT) 是一款以客户需求为导向的产品，现在它采用了名为 **FastIL** 的令人兴奋的流程，这是一项旨在提高测试吞吐量和效率的创新功能。FastIL 为连接领域的制造商带来了变革，为市场上速度最快的 IL/RL 测试仪提供了无与伦比的速度提升。



为什么选择 FastIL?

FastIL 满足了几个关键需求：

- 降低高昂的生产成本：对于每个被测设备 (DUT) 生产成本较高的制造商，尤其是那些拥有多根光纤的制造商，FastIL 提供了一种经济高效的解决方案，即在全面测试之前进行预筛选。
- 管理复杂的测试环境：使用开关和积分球的制造商将受益于 FastIL 能够在信道之间快速切换并高效地测量插入损耗。
- 轻松实现自动化和流程控制：对于集成自己软件的制造商而言，FastIL 可以完全自动化，并通过 SCPI 命令进行访问，使其成为自动化测试环境的完美选择。



主要优势

- 提高吞吐量：FastIL 允许您对 DUT 中的任意数量的信道执行插入损耗预筛选，从而显著提高您的测试吞吐量。
- 成本效率：通过预先筛选信道，您可以决定是执行全面测量还是重新加工被测设备，从而降低整体测试成本。
- 多功能性：FastIL 可以处理任何复杂程度或输入/输出映射的 DUT，与其他解决方案相比，提供了无与伦比的灵活性。
- 免费功能：FastIL 已原生包含在 PCTmax 中，无需额外费用，是满足您测试需求的经济之选。

吞吐量提升

借助快速插入损耗检测技术，制造商可以看到吞吐量提高超过 100%，具体取决于其被测器件的信道数量和每个信道的首次通过率。

吞吐量增加	单信道良率 80%	单信道良率 90%
1 个信道	13%	2%
12 个信道	100%	60%
64 个信道	170%	110%

常见问题

FastIL 测量被测设备 (DUT) 的速度能有多快？

FastIL 可以以每信道 0.2 秒的速度对 DUT 的插入损耗进行预筛选。虽然这不是计量级测量，但它提供了有关被测设备性能的宝贵见解。

为什么所有 IL 测量都不能是 FastIL 测量？

FastIL 将光开关和开关建立速度推向了物理极限。它旨在进行预筛选，快速识别良好和不良的信道，而不是像 PCT 在标准测量中那样提供运行良好的信道的精确测量值。

FastIL 是一项革命性的功能，可增强您的测试能力，提高吞吐量、成本效益和多功能性。通过将 FastIL 集成到您的测试流程中，您可以获得更快、更高效、更经济的结果。联系 VIAVI 代表，了解关于无源器件测试仪 (PCT) 的更多信息。